

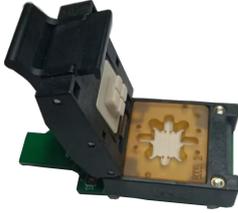


ZDSDTEST002 测试座封面手册



ZDSDTEST002 测试座使用手册

适应产品：LAG8,6.2*8mm封装的SD NAND产品。



测试座尺寸：长度5.36厘米，宽度2.49厘米，接口长度1.5厘米。



使用方法：直接将SD NAND放入该测试座内，不用焊接即可将SD NAND转为TF卡接口方便测试



测试座优点：

- 1.测试座可拆卸；（如果转接板损坏，测试座更换到新的转接板上可继续使用）；
- 2.芯片接触更稳定，不易脱落，测试速度更真实；
- 3.可根据实际需求通过更换限位框实现不同大小芯片识别使用（请保证芯片pin脚间距相同）



限位框可换（芯片pin脚相同，间距相同，通过更好限位框，可正常识别）如ZD品牌1GB SDNAND芯片大小为6*8mm，可通过更换限位框正常识别使用。

更换方法:

- 1.旋转底部亚克力保护板的四颗螺丝钉，卸下亚克力保护板。
- 2.旋下底座下方6颗螺丝钉，卸下底座（**不要将底座旋转倒置可能会导致连接针掉落**）



- 3.将测试座上盖打开拿出上底座，取下并更换限位框，再全部重新装上即完成更换限位框操作。

